

多層片式陶瓷電容器

MULTILAYER CHIP CERAMIC CAPACITOR

■ 通用型X5R片容

通用型X5R片容屬於II類低頻電容器，其電容量相對穩定。

● 特性

- * 電容容量較大，比容大。
- * 具有較高的電容量且較穩定，在-55°C ~ +85°C 工作範圍內，其溫度特性為 $\leq \pm 15\%$ 。
- * 叠層獨石結構，具有高可靠性。
- * 優良的焊接性和耐焊性，適用於回流焊和波峰焊。

● 應用

- * 適用於各種濾波，耦合電路。

● 產品規格型號表示方法

0805 X 105 K 500 N T
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①尺寸		
型號	英制(英寸)	公制(毫米)
0402	0.04×0.02	1.00×0.50
0603	0.06×0.03	1.60×0.80
0805	0.08×0.05	2.00×1.25
1206	0.12×0.06	3.20×1.60

②介質種類	
代碼	介質材料
X	X5R

③標稱電容量(PF)	
表示方式	實際值
104	10×10^4
105	10×10^5
106	10×10^6

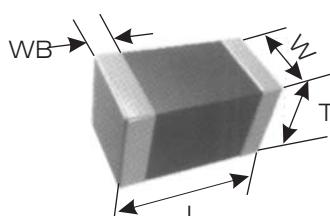
④誤差級別	
代碼	誤差
J	$\pm 5\%$
K	$\pm 10\%$

⑤工作電壓	
表示方法	實際電壓
6R3	6.3V
100	10V
250	25V

⑥端頭類別	
表示方法	端頭材料
S	純銀端頭
C	純銅端頭
N	三層電鍍端頭 (銀或銅層/鎳層/錫層)

⑦包裝方式	
表示方法	包裝
無標記	袋裝散包裝
T	編帶包裝
B	塑料盒散包裝

● 外形尺寸



規格型號		尺寸(mm)			
英制表示	公制表示	L	W	T	WB
0402	1005	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.25 ± 0.10
0603	1608	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.30 ± 0.10
0805	2012	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.80 ± 0.20 1.00 ± 0.20 1.25 ± 0.20	0.50 ± 0.20
1206	3216	3.20 ± 0.30	1.60 ± 0.20	0.80 ± 0.20 1.00 ± 0.20 1.25 ± 0.20	0.60 ± 0.30

■ X5R Multilayer Chip Ceramic Capacitor

X5R MLCC for General-use is class II low frequency capacitor, its capacitance is stable.

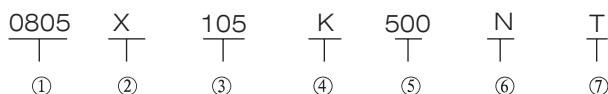
• Features

- * Capacitance is big, unit capacitance is big.
- * The Capacitance is stable, its operating temperature is -55°C and +85°C, within the range, the temperature coefficient is $\pm 15\%$.
- * It has multi-layer monolithic structure, has high reliability.
- * It has good solderability and soldering resistance, suitable for flow soldering/reflow soldering.

• Application

- * It is suitable for all kinds of filter and coupling circuits.

• Product Part Number Expression



① Dimensions		
Type	British (Inch)	Metric (mm)
0402	0.04 × 0.02	1.00 × 0.50
0603	0.06 × 0.03	1.60 × 0.80
0805	0.08 × 0.05	2.00 × 1.25
1206	0.12 × 0.06	3.20 × 1.60

② Dielectric Type	
Code	Dielectric Material
X	X5R

③ Normal Capacitance(PF)	
Expression Method	Actual Value
104	10×10^4
105	10×10^5
106	10×10^6

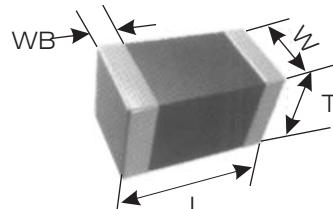
④ Capacitance Tolerance	
Code	Tolerance
J	$\pm 5\%$
K	$\pm 10\%$

⑤ Rated Voltage	
Expression Method	Actual Value
6R3	6.3V
100	10V
250	25V

⑥ Termination Type	
Expression Method	Termination Material
S	Pure Silver
C	Pure Copper
N	Three Layers Plating Terminal (Silver or Copper layer/Nickel layer/Tin layer)

⑦ Package Method	
Expression Method	Packaging
No Mark	Bulk Packaging in a Bag
T	Taping Packaging
B	Bulk Plastic Box Packaging

• Outside Dimension



Type		Dimension (mm)			
British expression	Metric expression	L	W	T	WB
0402	1005	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.25 ± 0.10
0603	1608	1.60 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.80 ± 0.10	0.30 ± 0.10
0805	2012	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.80 ± 0.20 1.00 ± 0.20 1.25 ± 0.20	0.50 ± 0.20
1206	3216	3.20 ± 0.30	1.60 ± 0.20	0.80 ± 0.20 1.00 ± 0.20 1.25 ± 0.20	0.60 ± 0.30

多層片式陶瓷電容器
MULTILAYER CHIP CERAMIC CAPACITOR

- 電容量範圍

項目	通用型X5R片容															
尺寸	0402				0603				0805				1206			
工作電壓	6.3V	10V	16V	25V	6.3V	10V	16V	25V	6.3V	10V	16V	25V	6.3V	10V	16V	25V
電容量																
1nF																
2.2nF																
3.3nF																
4.7nF																
6.8nF																
10nF																
22nF																
33nF																
47nF																
68nF																
100nF																
220nF																
330nF																
470nF																
680nF																
1 μ F																
2.2 μ F																
3.3 μ F																
4.7 μ F																
6.8 μ F																
10 μ F																
22 μ F																
33 μ F																
47 μ F																
100uF																

- Capacitance Range

Item	X5R MLCC for general-use															
Dimension	0402				0603				0805				1206			
Rated Voltage	6.3V	10V	16V	25V	6.3V	10V	16V	25V	6.3V	10V	16V	25V	6.3V	10V	16V	25V
Capacitance																
1nF																
2.2nF																
3.3nF																
4.7nF																
6.8nF																
10nF																
22nF																
33nF																
47nF																
68nF																
100nF																
220nF																
330nF																
470nF																
680nF																
1 μ F																
2.2 μ F																
3.3 μ F																
4.7 μ F																
6.8 μ F																
10 μ F																
22 μ F																
33 μ F																
47 μ F																
100uF																

多層片式陶瓷電容器
MULTILAYER CHIP CERAMIC CAPACITOR

■ 通用型X7R、X5R、Z5U、Y5V可靠性測試方法

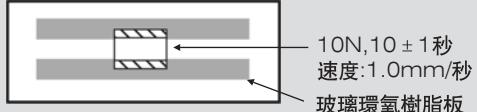
編號	項目	標準		測試方法
1	工作溫度範圍	X5R: -55°C ~ 85°C X7R: -55°C ~ 125°C	Z5U: 10°C ~ 85°C Y5V: -25°C ~ 85°C	
2	外觀	1. 瓷體顏色一致性好。 2. 芯片無可見損傷，光滑平整。 3. 瓷體無外露電極，裂痕，孔洞。 4. 端電極無裂痕，孔洞，磨損及表面氧化等。 5. 端電極應無延伸現象或延伸部分不超過端頭寬度的一半。		※ 在 $\times 10$ 倍以上的顯微鏡下觀察。
3	尺寸	在規定尺寸範圍內		※ 使用千分尺或游標卡尺。
4	電容量	在規定偏差範圍內		※ 測試儀器: HP4278A 電橋、HP4284 電橋。 ※ 測試條件: 1. 測試溫度: 25°C ± 5°C, 濕度: 30% ~ 75%。 2. 測試電壓: 1.0 ± 0.2V, (Y5V) 0.5 ± 0.2V (Z5U)。 3. 測試頻率: 1.0 ± 0.1 kHz。
5	損耗因數(D.F.)	X5R, X7R $Ur \geq 50V, Df \leq 250 \times 10^{-4}$ $Ur = 25V, 16V: Df \leq 350 \times 10^{-4}$ $Ur = 10V: Df \leq 500 \times 10^{-4}$ $Ur = 6.3V:$ $C < 3.3\mu F, Df \leq 500 \times 10^{-4}$ $C \geq 3.3\mu F, Df \leq 1000 \times 10^{-4}$	Z5U, Y5V $Ur \geq 50V, DF \leq 500 \times 10^{-4}$ $Ur = 25V:$ $C < 1.0 \mu F, DF \leq 700 \times 10^{-4}$ $C \geq 1.0 \mu F, DF \leq 900 \times 10^{-4}$ $Ur = 16V, 10V, 6.3V:$ $DF \leq 1250 \times 10^{-4}$	※ 測試儀器: 絶緣電阻測試儀(如: SF2511 絶緣測試機)。 ※ 測試方法: 施加額定工作電壓, 在 60 ± 5 秒內測量絕緣電阻。
6	絕緣電阻(I.R.)	$C < 25nF, IR \geq 10000M\Omega$ $C > 25nF, R \times C \geq 500S$	$C \leq 25nF, IR \geq 4000M\Omega$ $C > 25nF, R \times C \geq 500S$	※ 測試儀器: 絶緣電阻測試儀(如: SF2511 絶緣測試機)。 ※ 測試方法: 施加額定工作電壓, 在 60 ± 5 秒內測量絕緣電阻。
7	耐電壓強度	$> 3 \times$ 額定工作電壓		※ 施加3倍額定工作電壓, 持續 60 ± 1 秒, 未出現擊穿現象並且充電 / 放電電流低於 $50mA$ 。
8	電容量溫度特性	在工作溫度範圍內符合電容器特性溫度系數要求		※ 首先進行預處理: 進行 $150 + 0/-10^\circ C$ 熱處理 60 ± 5 分鐘, 然後在室溫條件下放置 24 ± 2 小時。 ※ 在 $-55 \sim 125^\circ C$ 或者 $-55 \sim 85^\circ C$ (X7R, X5R); $-25^\circ C \sim 85^\circ C + 10^\circ C \sim 85^\circ C$ (Y5V ~ Z5U) 範圍內測試電容量, 其電容值相對於 $25^\circ C$ 時數值的變化率應在規定範圍內。
9	可焊性	75% 端電極覆蓋錫		※ 將電容器浸在乙醇和松香溶液中。 然後浸入有鉛 $235 \pm 5^\circ C$ (無鉛 $245 \pm 5^\circ C$) 的混合焊錫溶液 2 ± 0.5 秒。 浸入速度: $25 \pm 2.5mm/\text{秒}$ 。

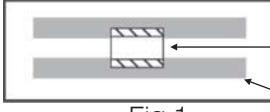


- X7R, X5R, Z5U, Y5V MLCC for general use reliability test method

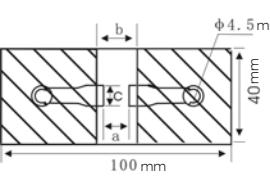
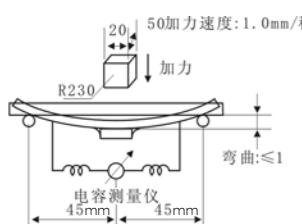
Number	Item	Standard		Test Method
1	Operating Temperature Range	X5R: -55°C ~ 85°C X7R: -55°C ~ 125°C	Z5U: 10°C ~ 85°C Y5V: -25°C ~ 85°C	
2	Appearance	1.Good ceramic body color continuity. 2.The chips have no visual damages and must be very smooth. 3.No exposed inner- electrode, no cracks or holes. 4.The outer electrode should have no cracks, holes, damages or surface oxidation. 5.Outer electrode no prolongation or the prolongation is less than half of that of the termination width.		※Check by using microscope $\geq 10 \times$.
3	Dimensions	Within the specified dimensions		※Using micrometer or vernier calipers
4	Capacitance)	Within the specified tolerance		※Measuring Equipments: HP4278 capacitance meter, HP4284 capacitance, ※Measuring Conditions: 1.Measuring Temperature: $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Humidity: 30% ~ 75%. 2.Measuring Voltage: $1.0 \pm 0.2\text{V}$. 3.Measuring Frequency: $1.0 \pm 0.1\text{MHz}$
5	Dissipation Factor (DF)	X5R,X7R Ur > 50V, DF $\leq 250 \times 10^{-4}$ Ur=25V,16V: DF $\leq 350 \times 10^{-4}$ Ur=10V: DF $\leq 500 \times 10^{-4}$ Ur=6.3V: $C < 3.3\mu\text{F}$, DF $\leq 500 \times 10^{-4}$ $C > 3.3\mu\text{F}$, DF $\leq 1000 \times 10^{-4}$	Z5U,Y5V Ur=50V,DF $\leq 500 \times 10^{-4}$ Ur=25V: $C < 1.0 \mu\text{F}$,DF $\leq 700 \times 10^{-4}$ $C > 1.0 \mu\text{F}$,DF $\leq 900 \times 10^{-4}$ Ur=16V、10V、6.3V: DF $\leq 1250 \times 10^{-4}$	
6	Insulation Resistance	C $\leq 25\text{nF}$,IR $\geq 10000\text{M}\Omega$ C > 25nF,R $\times C \geq 500\text{S}$	C $\leq 25\text{nF}$,IR $\geq 40000\text{M}\Omega$ 1C > 25nF,R $\times C \geq 500\text{S}$	※Measuring Equipment: Insulation resistance meter (such as Sf2511 insulation resistance). ※Measuring Method: Must measure at rated voltage, and measure the IR within 60 ± 5 seconds.
7	Withstanding Voltage	>3Ur		※Must measure at 3 times rated voltage, dwell time: 60 ± 1 seconds, no short and the changing/discharging current less than 50mA.
8	Capacitance Temperature Characteristic	Must meet the capacitor character temperature coefficient requirements within the operating temperature range.		※First, pre-heat: heat treat 60 ± 5 minutes at $150 + 0/-10^{\circ}\text{C}$, then set it for 24 ± 2 hours at room temperature. ※Measure the capacitance at $-55 \sim 125^{\circ}\text{C}$ or $-55 \sim 85^{\circ}\text{C}$, the capacitance change ratio comparing to that of 25°C must be within the specified range.
9	Solderability	Tin coverage should be 75% of the outer electrode		※Dip the capacitor into ethanol or colophony solution, and then dip it into $245 \pm 5^{\circ}\text{C}$ eutectic solder solution for 2 ± 0.5 seconds. Dipping speed: $25 \pm 2.5\text{mm/second}$.

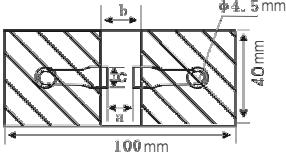
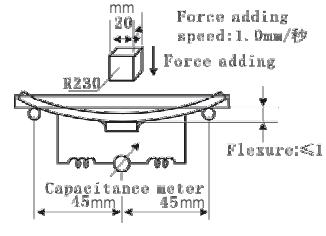
多層片式陶瓷電容器
MULTILAYER CHIP CERAMIC CAPACITOR

編號	項目	標準		測試方法									
10	耐焊接熱	外觀	無明顯缺陷	<p>※首先進行預處理：進行 $150+0/-10^\circ\text{C}$ 热處理 60 ± 5 分鐘，然后在室溫條件下放置 24 ± 2 小時。</p> <p>※然后按下表預熱電容器。將電容器浸入 $265 \pm 5^\circ\text{C}$ 的混合焊錫溶液 10 ± 1 秒。再在室溫條件下放置 24 ± 2 小時，然后進行測量。</p> <p>浸入速度：$25 \pm 2.5\text{mm}/\text{秒}$。</p> <p>※預熱條件如下：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>階段</th><th>溫度</th><th>時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>$100^\circ\text{C} - 120^\circ\text{C}$</td><td>1分鐘</td></tr> <tr> <td>2</td><td>$170^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C}$</td><td>1分鐘</td></tr> </tbody> </table>	階段	溫度	時間	1	$100^\circ\text{C} - 120^\circ\text{C}$	1分鐘	2	$170^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C}$	1分鐘
階段	溫度	時間											
1	$100^\circ\text{C} - 120^\circ\text{C}$	1分鐘											
2	$170^\circ\text{C} - 200^\circ\text{C}$	1分鐘											
電容量變化率	X7R, X5R: 在 20% 範圍內 Z5U, Y5V: 在 30% 範圍內												
D.F.	同初始標準												
I.R.	同初始標準												
11	端電極結合強度	不應出現端電極脫落或其它缺陷。		<p>※使用混合焊錫將電容器焊接在圖 1 中所示的測試夾具（玻璃環氧樹脂板）上。然后沿箭頭方向施加 10N 的力。焊接應利用烙鐵或使用回流焊方法進行，而且應謹慎作業，以使焊接均勻且不會出現熱衝擊等不良現象。</p>  <p>圖1</p>									
12	耐振動性	外觀	無缺陷或異常	<p>※將電容器焊接在測試夾具（玻璃環氧樹脂板）上。</p> <p>電容器應進行簡諧運動，其總幅值為 1.5mm，頻率在近似 $10 - 55\text{Hz}$ 之間均勻變化。頻率範圍（從 10 至 55Hz 再返回 10Hz）應在約 1 分鐘內完成。振動應在三個相互垂直方向各進行 2 小時（總計 6 小時）。</p>  <p>圖2</p>									
		電容量	在規定偏差範圍內										
		D.F.	同初始標準										
13	抗彎曲性能	不應出現裂痕或其他缺陷		<p>※使用混合焊錫將電容器焊接在圖 3 中所示的測試夾具（玻璃環氧樹脂板）上，然后在圖 4 所示的方向加力。焊接應利用烙鐵或使用回流焊方法進行，而且應謹慎作業，以使焊接均勻且不會出現熱衝擊等不良現象。</p>									

Number	Item	Standard	Test Method
10	Resistance to Soldering	Appearance	No defects visible
		Cap. Change ratio	X7R, X5R: within 20% Z5U, Y5V: within 30%
		DF	Same as original spec.
		IR	Same as original spec.
11	Adhesive Strength of Termination	No removal of the terminations or other defect shall occur	
		<p>※Solder the capacitor to the test jig (glass epoxy resin board) shown in Fig.1 using a eutectic solder. Then apply a 10N force in the direction shown as the arrowhead. The soldering shall be done either with an iron or using the reflow method and shall be conducted with care so that the soldering is uniform and free of defects such as heat shock, etc.</p>  <p>Fig.1</p> <p>10N, 10±1s Speed: 1.0mm/s Glss epoxy resinboard</p>	
12	Resistance to Vibration	Appearance	No defects or abnormalities
		Capacitance	Within the specified tolerance range
		D.F.	Same as original spec.
13	Bending Resistance	No cracks or other defects shall occur	
		<p>※Solder the capacitor to the test jig (glass epoxy resin board) shown in Fig.3 using a eutectic solder. Then apply a 10N force in the direction shown as Fig.4. The soldering shall be done either with an iron or using the reflow method and shall be conducted with care so that the soldering is uniform and free of defects such as heat shock, etc.</p>	

多層片式陶瓷電容器
MULTILAYER CHIP CERAMIC CAPACITOR

編號	項目	標準	測試方法																							
13	抗彎曲性能		  <table border="1" data-bbox="889 651 1238 786"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L×W (mm)</th> <th colspan="4">尺寸(mm)</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.5×2.0</td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>2.4</td> <td rowspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>4.5×3.2</td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>5.7×6.3</td> <td>4.5</td> <td>8.0</td> <td>5.6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	L×W (mm)	尺寸(mm)				a	b	c	d	4.5×2.0	3.5	7.0	2.4	1.0	4.5×3.2	3.5	7.0	3.7	5.7×6.3	4.5	8.0	5.6	
L×W (mm)	尺寸(mm)																									
	a	b	c	d																						
4.5×2.0	3.5	7.0	2.4	1.0																						
4.5×3.2	3.5	7.0	3.7																							
5.7×6.3	4.5	8.0	5.6																							
14	溫度循環	外觀 無缺陷或異常 電容量變化率 X7R, X5R: 在 ±20%範圍內 Z5U, Y5V: 在 ±30%範圍內 D.F. 同初始標準 I.R. 同初始標準	<table border="1" data-bbox="841 898 1254 1055"> <thead> <tr> <th>階段</th> <th>溫度(℃)</th> <th>時間(分鐘)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>最低工作溫度 ± 3</td> <td>30 ± 3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>常溫</td> <td>2—3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>最高工作溫度 ± 2</td> <td>30 ± 3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>常溫</td> <td>2—3</td> </tr> </tbody> </table>	階段	溫度(℃)	時間(分鐘)	1	最低工作溫度 ± 3	30 ± 3	2	常溫	2—3	3	最高工作溫度 ± 2	30 ± 3	4	常溫	2—3								
階段	溫度(℃)	時間(分鐘)																								
1	最低工作溫度 ± 3	30 ± 3																								
2	常溫	2—3																								
3	最高工作溫度 ± 2	30 ± 3																								
4	常溫	2—3																								
15	濕度(穩態)	外觀 無缺陷或異常 電容量變化率 X7R, X5R: 在 ±20%範圍內 Z5U, Y5V: 在 ±30%範圍內 D.F. 同初始標準 I.R. 同初始標準	※在 40 ± 2°C 和 90—95% 相對濕度條件下放置 500+24/-0小時。 然后將其移動到室溫條件下恢復放置 48 ± 2 小時，進行測量。																							
16	濕度負荷	外觀 無缺陷或異常 電容量變化率 X7R, X5R: 在 ±20%範圍內 Z5U, Y5V: 在 ±30%範圍內 D.F. 同初始標準 I.R. 同初始標準	※在 40 ± 2°C 和 90—95% 相對濕度條件下施加額定電壓 500+24/-0小時。然后將其移動到室溫條件下放置 48 ± 2 小時，進行測量。																							
17	壽命	外觀 無缺陷或異常 電容量變化率 X7R, X5R: 在 ±20%範圍內 Z5U, Y5V: 在 ±30%範圍內 D.F. 同初始標準 I.R. 同初始標準	※在上限溫度下施加2倍的額定工作電壓1000 ± 12小時，充 放電電流不超過50mA。將其移動到室溫條件下恢復放置 48 ± 2 小時，進行測量。																							

Number	Item	Standard	Test Method																									
13	Bending Resistance		  <p>Fig. 3</p> <p>Fig. 4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L×W (mm)</th> <th colspan="4">Dimension</th> </tr> <tr> <th></th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.5×2.0</td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>2.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.5×3.2</td> <td>3.5</td> <td>7.0</td> <td>3.7</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>5.7×6.3</td> <td>4.5</td> <td>8.0</td> <td>5.6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	L×W (mm)	Dimension					a	b	c	d	4.5×2.0	3.5	7.0	2.4		4.5×3.2	3.5	7.0	3.7	1.0	5.7×6.3	4.5	8.0	5.6	
L×W (mm)	Dimension																											
	a	b	c	d																								
4.5×2.0	3.5	7.0	2.4																									
4.5×3.2	3.5	7.0	3.7	1.0																								
5.7×6.3	4.5	8.0	5.6																									
14	Temperature Cycle	Appearance Cap. Change ratio D.F. I.R.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stage</th> <th>Temperature (°C)</th> <th>Time (min.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Min. Operating Temperature±3</td> <td>30±3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Room Temperature</td> <td>2—3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Max. Operating Temperature 2</td> <td>30±3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Room Temperature</td> <td>2—3</td> </tr> </tbody> </table>	Stage	Temperature (°C)	Time (min.)	1	Min. Operating Temperature±3	30±3	2	Room Temperature	2—3	3	Max. Operating Temperature 2	30±3	4	Room Temperature	2—3										
Stage	Temperature (°C)	Time (min.)																										
1	Min. Operating Temperature±3	30±3																										
2	Room Temperature	2—3																										
3	Max. Operating Temperature 2	30±3																										
4	Room Temperature	2—3																										
15	Humidity Steady State	Appearance Cap. Change ratio D.F. I.R.	※ Set the capacitor for 500+24/-0 hours at the condition of 40±2°C and 90-95% humidity. Then remove and set it for 48±2 hours at room temperature, then measure.																									
16	Humidity Load	Appearance Cap. Change ratio D.F. I.R.	※ Apply rated voltage to the capacitor for 500+24/-0 hours at the condition of 40±2°C and 90-95% humidity. Remove and set it for 48±2 hours at room temperature, then measure.																									
17	Life Test	Appearance Cap. Change ratio D.F. I.R.	※ Apply two times rated voltage to the capacitor for 1000±12 hours at the upper temperature limits, the charging current should be less than 50mA. Remove and set it for 24 2 hours at room temperature, then measure.																									

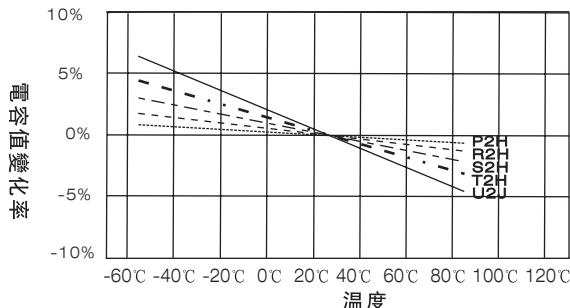
多層片式陶瓷電容器

MULTILAYER CHIP CERAMIC CAPACITOR

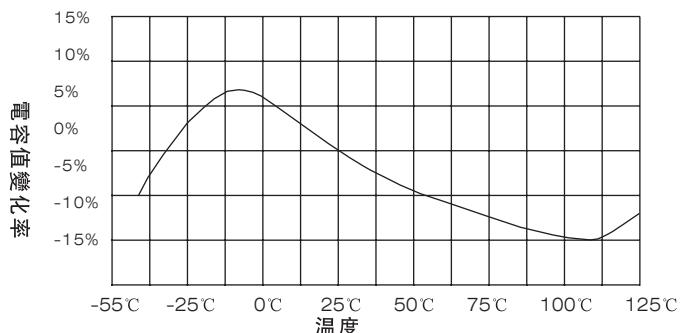
■ 通用型片容特性曲線

- COG和PH、RH、SH、TH、UH系列

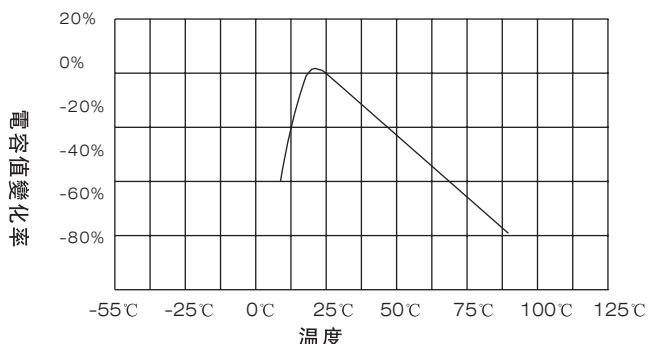
溫度系數圖



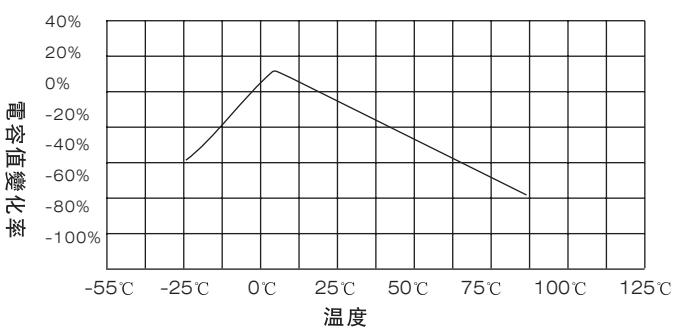
X7R溫度特性



Z5U溫度特性

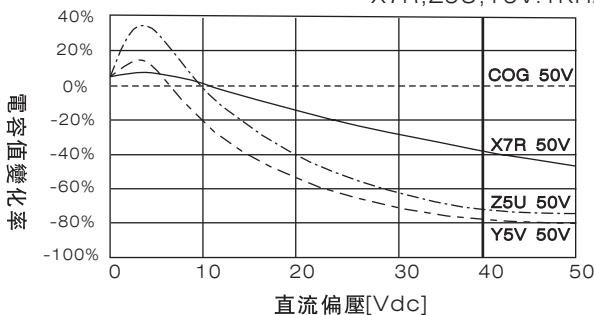


Y5V溫度特性



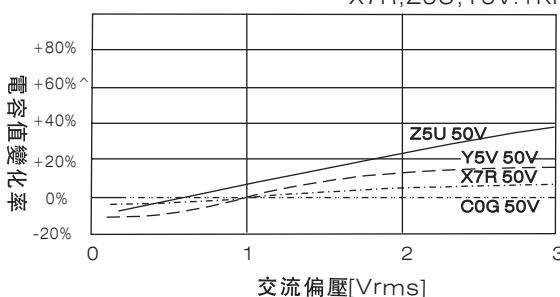
● 電容器偏壓特性圖

測量條件: COG :1MHZ
X7R,Z5U,Y5V:1KHZ

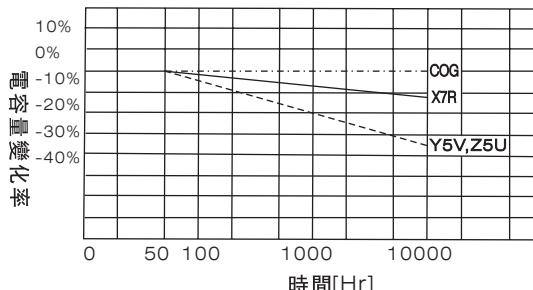


● 電容器交流電壓特性圖

測量條件: COG :1MHZ
X7R,Z5U,Y5V:1KHZ

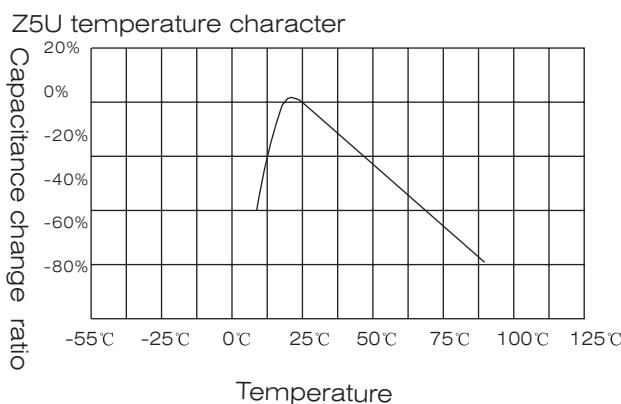
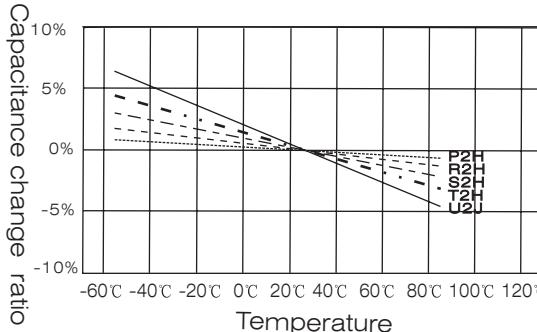


● 電容器老化特性圖

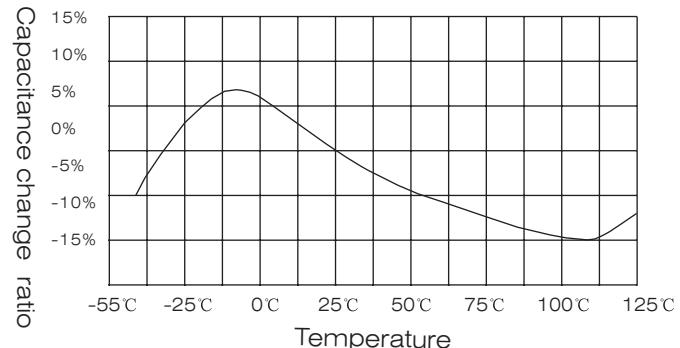


■ GENEREL-USE MLCC CHARCCTER PROFILES

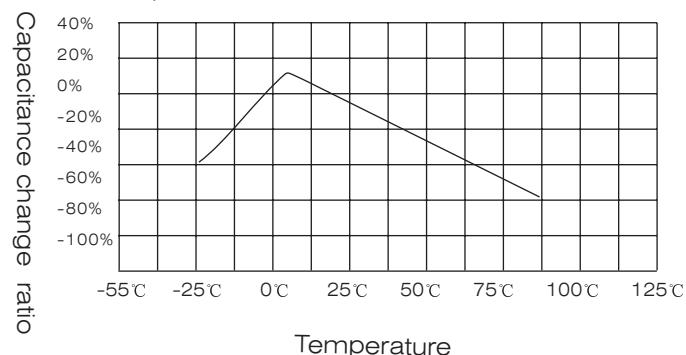
- COG and PH, RH, SH, TH, UH series
temperature coefficient



X7R tempreture characteristics

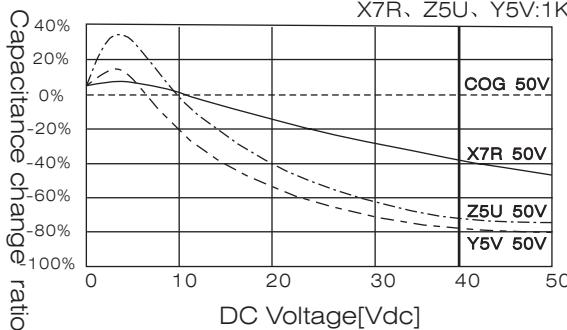


Y5V temperature characteristics



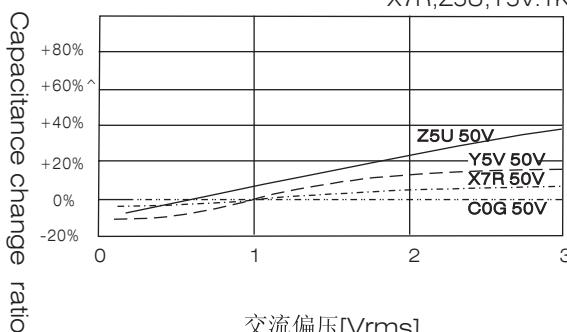
- DC Voltage Characteristics

Measuring condition COG :1MHz
X7R, Z5U, Y5V:1KHz



- Capacitance-AC Voltage

Characterics Measuring condition: COG :1MHz
X7R,Z5U,Y5V:1KHz



- Capacitance change_aging

